



THEMA: »Messtechnik für die Beschichtungsprüfung«

Mittwoch, 30. März, 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr

PROGRAMM

08:30 – 08:45 Uhr **Begrüßung**
Dr. Daniel Carl, stellvertretender Institutsleiter, Fraunhofer IPM

Bildgebende Fluoreszenzmessung

08:45 – 09:05 Uhr **Messsysteme und Anwendungen**
Dr.-Ing. Albrecht Brandenburg, Gruppenleiter Optische Oberflächenanalytik, Fraunhofer IPM

Sensitive Infrarot-Detektion

09:05 – 09:25 Uhr **Systeme zur Prüfung von dünnen Beschichtungen**
Dr. Benedikt Hauer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fraunhofer IPM

09:25 – 09:40 Uhr **Anwendung: Ultradünne Beschichtungen auf Kunststoff**
Dr. Armin Mohr, Geschäftsführer, Plasma Electronic GmbH

Tiefenaufgelöste Analyse mit Laserinduzierter Plasmaspektroskopie

09:40 – 10:00 Uhr **Systeme für die orts aufgelöste Elementanalyse**
Dr. Carl Basler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fraunhofer IPM

10:00 – 10:15 Uhr **Anwendung: Prüfung von Batteriefolien**
Dr. Andreas Würsig, stv. Geschäftsfeldleiter Leistungselektronik, Fraunhofer ISIT

10:15 – 10:30 Uhr **WRAP UP**
Dr. Daniel Carl, stellvertretender Institutsleiter, Fraunhofer IPM

10:30 – 11:00 Uhr **EXPERTENGESPRÄCHE**
in frei wählbaren Gruppen an virtuellen Kaffeetischen

 **Dr.-Ing. Albrecht Brandenburg**
Gruppenleiter Optische Oberflächenanalytik
Telefon +49 761 8857-306
albrecht.brandenburg@ipm.fraunhofer.de

**Fraunhofer-Institut
für Physikalische Messtechnik IPM**
Georges-Köhler-Allee 301, 79110 Freiburg
www.ipm.fraunhofer.de/online-forum

 **Fraunhofer**
IPM